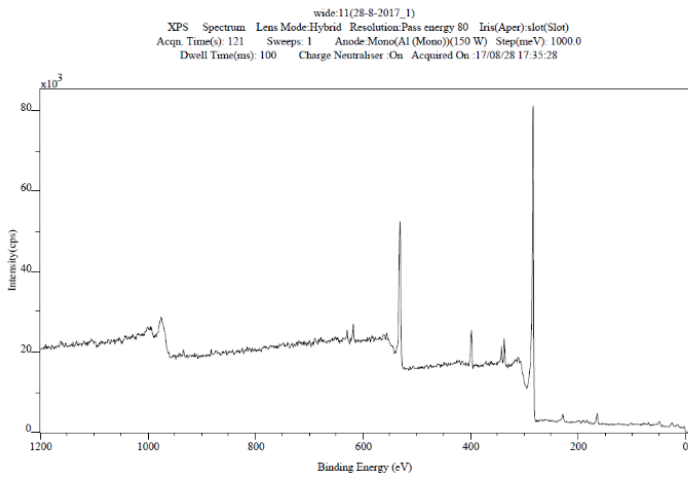




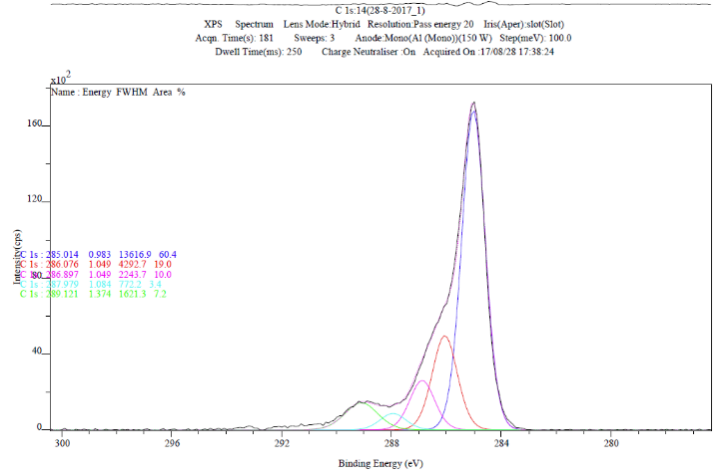
ผลวิเคราะห์พื้นผิววัสดุด้วยเทคนิค XPS จากโปรแกรม VisionII

ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS นั้น ผู้ให้บริการ จะได้อะเอียดข้อมูลทั้งหมด 3 ชนิดดังนี้

1.1 **สเปกตรัม XPS** : ผู้ให้บริการจะได้รับเป็นแบบ PDF file ที่มีความละเอียดสูง และมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ต่อ 1 สเปกตรัม ดังแสดงตัวอย่างด้านล่างนี้



Survey scan เพื่อคุณภาพรวมบนพื้นผิว



High Resolution Scan เพื่อดูพันธะทางเคมี

1.2 **Quantification report** : ในการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่าง ผู้ให้บริการจะได้รับรายงานปริมาณและจำนวนธาตุที่พบจากการคำนวณของเครื่องทุกครั้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที ดังแสดงตัวอย่างด้านล่างนี้

Quantification Report
/C=/data/28-8-2017/28-8-2017_1.dset Thu Aug 31 09:50:01 2017

State : Angle Name : Position 3

Peak	Type	Position BE (eV)	FWHM (eV)	Raw Area (cps eV)	RSF	Atomic Mass	Atomic Conc %	Mass Conc %
I 3d	Reg	619.400	2.646	30010.0	10.343	126.904	0.21	1.98
O 1s	Reg	532.400	3.792	150585.0	0.780	15.999	14.18	16.88
N 1s	Reg	399.400	2.570	28000.0	0.477	14.007	4.44	4.62
Pd 3d	Reg	338.400	1.904	24800.0	5.356	106.534	0.36	2.84
C 1s	Reg	284.400	2.714	281320.0	0.278	12.011	79.82	71.32
S 2p	Reg	165.400	2.861	8590.0	0.668	32.065	0.99	2.37

